

# IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

In re Application of

Kazuo HIRONISHI

Serial No.: Unassigned

Group Art Unit: Unassigned

Filed: March 12, 2001

Examiner: Unassigned

For: OPTICAL SIGNAL PROCESSING DEVICE

# SUBMISSION OF CERTIFIED COPY OF PRIOR FOREIGN APPLICATION IN ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF 37 C.F.R. §1.55

Honorable Commissioner of Patents and Trademarks Washington, D.C. 20231

Sir:

In accordance with the provisions of 37 C.F.R. §1.55, the applicant(s) submit(s) herewith a certified copy of the following foreign application:

Japanese Patent Application No. 2000-264186, filed: August 31, 2000.

It is respectfully requested that the applicant(s) be given the benefit of the foreign filing date as evidenced by the certified papers attached hereto, in accordance with the requirements of 35 U.S.C. §119.

By:

Respectfully submitted,

STAAS & HALSEY LLP

Date: March 12, 2001

James D. Halsey, Jr. Registration No. 22,729

700 Eleventh Street, N.W., Suite 500 Washington, D.C. 20001

(202) 434-1500

# 日本国特許庁 PATENT OFFICE JAPANESE GOVERNMENT

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出 願 年 月 日 Date of Application:

2000年 8月31日

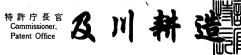
出 願 番 号 Application Number:

特願2000-264186

出 類 Applicant (s):

富士通株式会社

2000年12月15日



#### 特2000-264186

【書類名】

特許願

【整理番号】

0000180

【提出日】

平成12年 8月31日

【あて先】

特許庁長官殿

【国際特許分類】

G02F 01/00

【発明の名称】

光信号机理装置

【請求項の数】

2

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号 富士通

株式会社内

【氏名】

廣西 一夫

【特許出願人】

【識別番号】

000005223

【氏名又は名称】 富士通株式会社

【代理人】

【識別番号】

100075384

【弁理士】

【氏名又は名称】

松本 昂

【電話番号】

03-3582-7477

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

001764

【納付金額】

21,000円

1

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

要

【包括委任状番号】 9704374

【書類名】 明細書

【発明の名称】 光信号処理装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 入力ポート及び複数の出力ポートを有し上記入力ポートには 異なる波長を有する複数の光信号を波長分割多重して得られたWDM信号光が供 給される光デマルチブレクサと.

出力ポート及び複数の入力ポートを有する光マルチプレクサと、

上記複数の出力ポートと上記複数の入力ポートとをそれぞれ接続する複数の光 パスと、

上記複数の光パスの少なくとも一つに設けられた少なくとも一つの遅延調整器 と、

上記複数の光信号の少なくとも一つの変調位相を検出する検出器と、

上記検出器により検出された位相に基き上記遅延調整器を制御するコントローラとを備えた光信号処理装置。

【請求項2】 変調位相調整部と全光再生部とを備えた光信号処理装置であって、

上記変調位相調整部は、

入力ポート及び複数の出力ポートを有し上記入力ポートには異なる波長を有する複数の光信号を波長分割多重して得られたWDM信号光が供給される光デマルチプレクサと、

出力ポート及び複数の入力ポートを有する光マルチプレクサと、

上記複数の出力ポートと上記複数の入力ポートとをそれぞれ接続する複数の光 パスと、

上記複数の光パスの少なくとも一つに設けられた少なくとも一つの遅延調整器 と、

上記複数の光信号の少なくとも一つの変調位相を検出する検出器と、

上記検出器により検出された位相に基き上記遅延調整器を制御するコントローラとを備えている光信号処理装置。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、全光再生中継に適した光信号処理装置に関する。

[0002]

【従来の技術】

光レベルで波形整形を行う従来の波形整形器として、マッハツェンダ干渉計(MZI)型光ゲートがある。この光ゲートは、位相シフトを与えるための第1及び第2の非線形光学媒質を含むマッハツェンダ干渉計を例えば光導波路基板上に集積化して構成される。連続波(CW)光としてのプローブ光が等分配されて第1及び第2の非線形光学媒質に供給される。このとき、等分配されたプローブ光の干渉により出力光が得られないように干渉計の光路長が設定されている。

[0003]

第1及び第2の非線形光学媒質の一方には更に光信号が供給される。光信号及びプローブ光のパワーを適切に設定することによって、光信号に同期する変換光信号がこの光ゲートから出力される。変換光信号はプローブ光と同じ波長を有している。

[0004]

第1及び第2の非線形光学媒質の各々として半導体光アンプ(SOA)を用いることが提案されている。例えば、波長1.  $5\mu$ m帯において、両端面を無反射化処理したInGaAs-SOAを各非線形光学媒質として用い、これらをInP/GaInAsP基板上に集積化したものが作製されている。

. [0005]

従来知られている他の波形整形装置として、非線形光ループミラー(NOLM)がある。NOLMは、方向性結合される第1及び第2の光路を含む第1の光力プラと、第1及び第2の光路を接続するループ光路と、ループ光路に方向性結合される第3の光路を含む第2の光カプラとを備えている。

[0006]

ループ光路の一部又は全体を非線形光学媒質から構成するとともに、第1及び 第3の光路にそれぞれプローブ光及び光信号を供給することによって、変換光信 号が第2の光路から出力される。

[0007]

NOLMにおける非線形光学媒質としては光ファイバが一般的である。特に、 非線形光学媒質としてSOAを用いたNOLMはSLALOM (Semiconductor Laser Amplifier in a Loop Mirror) と称される。

[0008]

ところで、近年実用化されている光ファイバ通信システムにおいては、伝送路 損失や分岐損失等による信号パワーの低下を、エルビウムドープファイバ増幅器 (EDFA)等の光増幅器を用いて補償している。光増幅器はアナログ増幅器で あり、信号を線形増幅するものである。この種の光増幅器においては、増幅に伴って発生する自然放出光(ASE)雑音の付加により信号対雑音比(S/N比) が低下するので、中継数ひいては伝送距離に限界が生じる。また、光ファイバの 持つ波長分散やファイバ内の非線形光学効果による波形劣化も伝送限界を与える 要因である。こうした限界を打破するためには、信号をデジタル的に処理する再 生中継器が必要であり、その実現が望まれている。特に、全ての処理を光レベル において行う全光再生中継器は、信号のビットレートやパルス形状等に依存しな いトランスペアレントな動作を実現する上で重要である。

[0009]

全光再生中継器に必要な機能は、振幅再生又はリアンプリフィケーション(Reamplification)と、波形整形又はリシェイピング(Reshaping)と、タイミング再生又はリタイミング(Retiming)とである。これらの機能は3R機能と称され、特に前二者は2R機能と称される。

[0010]

波形整形器と光増幅器を組み合わせることにより、或いは光増幅機能を有する 波形整形器を用いることにより、2R機能を提供することができる。また、それ に加えてクロック再生器を並行して用いることにより3R機能を提供することが できる。

[0011]

【発明が解決しようとする課題】

異なる波長を有する複数の光信号を波長分割多重(WDM)して得られたWD M信号光に対応して、光レベル時間多重(OTDM)型の全光再生中継器を用いる場合、入力する複数の光信号の変調位相に安定した時間秩序がないと、安定した再生処理を行うことができないという問題がある。

[0012]

よって、本発明の目的はWDM信号光の各光信号の変調位相に安定した時間秩序を与えることができる光信号処理装置を提供することである。

[0013]

【課題を解決するための手段】

本発明によると、入力ポート及び複数の出力ポートを有し上記入力ポートには 異なる波長を有する複数の光信号を波長分割多重して得られたWDM信号光が供 給される光デマルチプレクサと、出力ポート及び複数の入力ポートを有する光マ ルチプレクサと、上記複数の出力ポートと上記複数の入力ポートとをそれぞれ接 続する複数の光パスと、上記複数の光パスの少なくとも一つに設けられた少なく とも一つの遅延調整器と、上記複数の光信号の少なくとも一つの変調位相を検出 する検出器と、上記検出器により検出された位相に基づき上記遅延調整器を制御 するコントローラとを備えた光信号処理装置が提供される。

[0014]

この構成によると、上述の条件に従ってコントローラが遅延調整器を制御する ことによって、WDM信号光の各光信号の変調位相に安定した時間秩序を与える ことができる。

[0015]

本発明の他の側面によると、変調位相調整部と全光再生部とを備えた光信号処理装置であって、上記変調位相調整部は、入力ポート及び複数の出力ポートを有し上記入力ポートには異なる波長を有する複数の光信号を波長分割多重して得られたWDM信号光が供給される光デマルチブレクサと、出力ポート及び複数の入力ポートを有する光マルチブレクサと、上記複数の出力ポートと上記複数の入力ポートとをそれぞれ接続する複数の光パスと、上記複数の光パスの少なくとも一つに設けられた少なくとも一つの遅延調整器と、上記複数の光信号の少なくとも

一つの変調位相を検出する検出器と、上記検出器により検出された位相に基き上 記遅延調整器を制御するコントローラとを備えている光信号処理装置が提供され る。

[0016]

【発明の実施の形態】

以下、本発明の望ましい実施の形態を添付図面に従って詳細に説明する。全図 を通して同一又は類似の部分には同一の符号が付される。

[0017]

図1を参照すると、本発明による光信号処理システムの実施形態が示されている。このシステムは、光ファイバ伝送路1におけるWDM信号光の伝搬方向上流側から順に変調位相調整部3及び全光再生部5を設けて、構成される。変調位相調整部3は、WDM信号光の各波長の光信号の変調位相を測定し、それを調整することによってある時間秩序を保った状態でWDM信号光を出力する。変調位相調整部3の具体的構成については後述する。全光再生部5としては、前述したマッハツェンダ干渉計型光ゲートやNOLMを用いることができる。

[0018]

図2は本発明による光信号処理装置の基本構成を示すブロック図である。本発明による装置は、例えば、図1に示される変調位相調整部3として使用することができる。

[0019]

図2に示される装置は、WDMに適合するために、入力ポート及び複数の出力ポートを有する光デマルチプレクサ(DEMUX)2と、出力ポート及び複数の入力ポートを有する光マルチプレクサ(MUX)4とを備えている。光デマルチプレクサ2の入力ポートには、異なる波長を有する複数の光信号を波長分割多重して得られたWDM信号光が供給される。光デマルチプレクサ2において、入力ポートと各出力ポートとは特定の波長によって光学的に結合される。また、光マルチプレクサ4において、各入力ポートと出力ポートとは特定の波長によって光学的に結合される。

[0020]

光デマルチプレクサ2の複数の出力ポートと光マルチプレクサ4の複数の入力ポートはそれぞれ複数の光パス6によって接続されている。複数の光パス6の少なくとも一つには遅延調整器8が設けられている。本実施形態では、全ての光パス6に遅延調整器8が設けられている。

[0021]

WDM信号光は、光デマルチプレクサ2によって複数の光信号に分けられ、それぞれ遅延調整器8による遅延を受けた後、再び光マルチプレクサ4によって波展分割多重される。光マルチプレクサ4から出力されたWDM信号光は、光カプラ10によりその一部がモニタ光として取り出された後この装置から出力される

[0022]

モニタ光は検出器12に供給される。検出器12は、WDM信号光の複数の光信号の少なくとも一つの位相を検出する。そして、コントローラ14が検出器12により検出された変調位相に基き遅延調整器8を制御する。

[0023]

図3は本発明による光信号処理装置の第1実施形態を示す主要部のブロック図である。光カプラ10(図2参照)からのモニタ光は、光カプラ16により2分岐され、その一方は光フィルタ18に供給され他方はチューナブル光フィルタ28に供給される。光フィルタ18は基準となる波長2sを有する光信号を通過させる。光フィルタ18を通過した光信号は、光/電気変換器(O/E)20により電気信号に変換され、その電気信号は増幅器22により増幅されてバンドバスフィルタ24に供給される。バンドパスフィルタ24を通過することによって基準クロック成分が抽出され、再生された基準クロック成分は増幅器26により増幅されて位相比較器38に供給される。

[0024]

チューナブル光フィルタ28は任意の波長 i を有する光信号を通過させる。 チューナブル光フィルタ28を通過した光信号は光/電気変換器30により電気 信号に変換され、その電気信号は増幅器32により増幅されてバンドバスフィル ダ34に供給される。バンドバスフィルタ34を通過することによってクロック 成分が抽出され、そのクロック成分は増幅器36により増幅されて位相比較器38に供給される。位相比較器38は供給された基準クロック成分及びクロック成分の位相比較を行い、その結果はコントローラ14に与えられる。コントローラ14は、基準クロック成分及びクロック成分の位相が一致するように波長え1の遅延調整器8による遅延を制御する。尚、チューナブル光フィルタ28が通過させる光信号の波長え1はコントローラ14からの信号によって選択される。

[0025]

図3に示される実施形態のように基準クロックとクロックの位相同期を行うためには、位相同期ループを用いることができる。

[0026]

図4は一般的な位相同期ループの構成を示すブロック図である。位相同期ループにおいて、周波教差及び位相差が同時に縮小することを以下に説明する。

[0027]

入力信号V i (t) , V C O (電圧制御発振器) の出力V o (t) は、それぞれ、

 $Vi(t) = sin(\omega it + \phi i(t))$ 

 $Vo(t) = cos(\omega ot + \phi o(t))$ 

で与えられるので、乗算回路を用いた位相比較器の出力は、

Ve (t) = Ke  $\sin (\omega i t + \phi i (t)) \times \cos (\omega o t + \phi o (t))$ ) = 1/2 Ke { $\sin ((\omega i - \omega o) t + \phi i (t) - \phi o (t)) + \sin ((\omega i + \omega o) t + \phi i (t) + \phi o (t)$ }

となる。第2項は回路の周波数制限から減衰すると考えると、差周波数成分だけ になり、

Ve (t) = 1/2Ke sin (( $\omega$ i- $\omega$ o) t+ $\phi$ i (t) - $\phi$ o (t)

となる。角周波数ωの差を位相項φに含めると考えると、

Ve (t) = 1/2 Ke sin ( $\phi$  i (t)  $-\phi$  o (t))

が得られる。ループフィルタのインバルス応答関数を f (t) とすると、ループ フィルタの出力 V d は、

 $Vd(t) = \int_{0} \infty Ve(\tau) f(t-\tau) d\tau$ 

となる。因果性から $t-\tau$ <0でf(t)=0であるので、上式を変形すると、

 $Vd(t) = \int_{0} \infty Ve(t-\tau) f(t) d\tau$ 

が得られる。また、VCOの出力をφoとすると、

 $d \phi_0 (t) / d t = K o V d (t)$ 

となる。

以上の式から、

 $d\phi_0(t) / dt = K \circ K \circ \int_0^\infty V \circ (t - \tau) f(t) d\tau = K \int_0^\infty \{s\}$   $i n (\phi i (t - \tau)) - s i n (\phi \circ (t - \tau)) \} f(t) d\tau = K \int_0^\infty \{s\}$ 

( ( $\phi$  i (t -  $\tau$ ) ) - ( $\phi$  o (t -  $\tau$ ) ) } f (t) d  $\tau$ 

となる。ここで、K=1/2 K o K e , s i n  $\theta = \theta$ 

この式をラプラス変換すると、

$$\Phi \circ (S) = K (\Phi i (S) - \Phi \circ (S)) F (S) / S$$

となる。よって、

[0028]

【数式1】

$$\Phi_0(S) = \frac{KF(S)/S}{1+KF(S)/S} \Phi_i(S)$$

[0029]

が得られる。 $H(S) = \Phi_0(S) / \Phi_i(S) = KF(S) / (S + KF(S))$ 

とすると、位相誤差関数E(S)は、

E (S) = 1 - H (S) = 
$$(\Phi i (S) - \Phi_0 (S)) / \Phi i (S) = \Phi_0 (S)$$

となる。

[0030]

入力信号とVCOの自然発振周波数との間に Δ f の周波数差があった場合、定 常位相誤差φ e s は、ラプラス変換の最終値定理(ラプラス変換の微分公式から 道出できる)

$$\phi$$
 e s = L i m  $\phi$  e (t) = L i m (S  $\phi$  e (S))  
t  $\rightarrow \infty$  S  $\rightarrow$  0

٤.

t = 0でφi(t) =  $2\pi\Delta f t + \theta$  oつまり、φi(S) =  $2\pi\Delta f / S^2 + \theta$  o / S /  $\xi$  # H N  $\xi$ 

[0031]

【数式2】

$$\phi$$
 e s = L i m  $\phi$  e (t) = L i m(S(S/(S+KF(S))(2  $\pi$   $\Delta$  f/S'+ $\theta$  o/S))  
t  $\rightarrow \infty$  S  $\rightarrow$  0

$$= \frac{2\pi}{\text{KF (0)}} \Delta f$$

となる。

[0033]

つまり、最初の位相誤差(周波数差を含む)は位相同期ループによってKF( 0)分の1に縮小される。

[0034]

図5は本発明による光信号処理装置の第2実施形態を示す主要部のブロック図である。ここでは、検出器12(図2参照)は、任意の波長を有する光信号を通過させるチューナブル光フィルタ40と、チューナブル光フィルタ40を通過した第1の波長(基準波長) 2sを有する光信号及び第2の波長2iを有する光信号に基きそれぞれ第1及び第2のクロックを再生する回路と、第1及び第2のクロックの位相比較を行う位相比較器50とを含む。クロックを再生する回路は、チューナブル光フィルタ40を通過した光信号を電気信号に変換する光/電気変換器42と、変換器42の出力を増幅する増幅器44と、増幅器44の出力が供給されるバンドパスフィルタ46と、バンドパスフィルタ46の出力を増幅する増幅器48とを含む。

[0035]

位相比較器50、ループフィルタ52、スイッチ54及びVCO56によって 位相同期ループが構成されている。スイッチ54、VCO56及びチューナブル 光フィルタ40はコントローラ14によって制御される。

[0036]

次に、図5に示される装置の動作のフローを詳細に説明する。

[0037]

まず、チューナブル光フィルタ40が波長೩sの光信号のみを通過させるようにコントローラ14がチューナブル光フィルタ40をチューニングする。次いで、コントローラ14によってスイッチ54がオン状態にされ、位相同期ループが機能するようにされる。つまり、この状態では、ループフィルタ52の出力に従ってVCO56の発振状態が変化する。このとき、位相同期ループの動作に従って、波長೩sの光信号のクロックに同期した基準クロックが得られる。VCO56はループフィルタ52の出力をメモリする機能を有しているので、基準クロックの周波数及び位相は固定化することができる。

[0038]

次いでコントローラ14によってスイッチ54がオフ状態にされる。

[0039]

その後、チューナブル光フィルタ40が波長 \(\lambda\) i の光信号のみを通過させるようにコントローラ \(14がチューナブル光フィルタ40をチューニングする。その後、位相比較器 \(\lambda\) 6 で波長 \(\lambda\) i の光信号から得られたクロックと波長 \(\lambda\) s の光信号のクロックに同期した基準クロックとの位相差が測定され、その結果はコントローラ \(\lambda\) 4 に供給される。そして、測定された位相差が望ましい値、例えば位相差のになるようにコントローラ \(\lambda\) 4 が波長 \(\lambda\) i の遅延調整器 \(\lambda\) 8 を制御する。

[0040]

図6は本発明による光信号処理装置の第3実施形態を示す主要部のブロック図である。ここでは、図3に示されるのと同じように、光フィルタ18と、チューナブル光フィルタ28と、光/電気変換器20及び30と、増幅器22,26,32及び36と、バンドパスフィルタ24及び34とが用いられている。また、波長2sの光信号から得られるクロックに関連して、図5に示される機成に進じ

て位相同期ループが構成されている。この位相同期ループは、位相比較器50、 ループフィルタ52及びVCO56′からなり、VCO56′はループフィルタ 52の出力メモリ機能を有していない。これに伴い、スイッチ54(図5参照) は省略されている。

[0041]

この実施形態では、位相同期ループを用いて常時波長  $\lambda$  s の光信号のクロック に同期した基準クロックを発振させておいて、その基準クロックと波長  $\lambda$  i の光信号から得られるクロック成分とを位相比較器  $\lambda$  5 8に入力している。そして、測定される位相差が最も小さくなるようにコントローラ  $\lambda$  1 0 遅延調整器 8 を制御する。

[0042]

このように、本実施形態では、光フィルタ18を通過した光信号に基き基準クロックを発生するようにしている。そのために、位相比較器50、ループフィルタ52及びVCO56′を含む位相同期ループが用いられている。

[0043]

図7は本発明による光信号処理装置の第4実施形態を示すブロック図である。 光カプラ10により抽出されたモニタ光としてのWDM信号光は、任意の波長を 有する光信号を通過させる光フィルタ60に供給される。基準パルス光を発生す るために、発振器62により駆動されるパルス光源64が用いられている。光フィルタ60を通過した光信号及び基準パルス光は利得飽和デバイス(SGD)6 に供給される。利得飽和デバイス66の出力は光測定部68に供給される。光 測定部68は利得飽和デバイス66から出力される光の平均パワーを検出する。 この場合、コントローラ14は、光測定部68により検出された平均パワーが小さくなるように対応する遅延調整器8を制御する。

[0044]

図8の(A)及び(B)を参照すると、それぞれ利得飽和デバイス66の入力 及び出力の波形が示されている。パルス光源64から出力される基準パルス光は 、各光信号のクロック周波数のN(Nは自然数)分の1のクロック周波数を有し ている。また、基準パルス光のパルス幅は光信号のパルス幅とほぼ等しい。図で はN=1として波形が示されている。

[0045]

図8の(A)に示されるように、光信号と基準パルス光のタイミングがずれている場合、図8の(B)に示されるように、利得飽和デバイス66における利得飽和の結果、光信号と基準パルス光が重なっている部分のパワーは各パワーの和よりも小さくなる。より特定的には、光信号と基準パルス光の変調位相が一致している場合に利得飽和デバイス66から出力される光の平均パワーが最小値となる。従って、図7に示される光測定部68で検出された平均パワーが最小になるようにコントローラ14が遅延調整器8を制御することによって、各光信号の変調位相を基準パルス光の変調位相に一致させることができる。

[0046]

光信号のクロック周波数のN分の1の発振周波数が発振器62及びパルス光源64において得られていない場合には、コントローラ14が発振器62の発振周波数を微調整することができる。即ち、利得飽和デバイス66の平均出力パワーの変動の時間周期が大きくなるように発振周波数を調整することによって、光信号のクロック周波数のN分の1のクロック周波数を有する基準パルス光が得られる。

[0047]

図9は本発明による光信号処理装置の第5実施形態を示すブロック図である。 ここでは、基準波長  $\lambda$  s の光信号を通過させる光フィルタ70と任意の波長  $\lambda$  i を有する光信号を通過させる光フィルタ72とを並列に設け、これらを通過した 光信号が利得飽和デバイス66に入力するようにしている。光測定部68及びコントローラ14は図7に示される実施形態と同じように機能する。

[0048]

この構成によると、発振器62及びパルス光源64を用いることなしに、図7に示される実施形態における原理に準じて波長λiの光信号の位相を波長λsの 光信号の変調位相に一致させることができる。尚、光フィルタ70及び72が無くても動作は可能である。

[0049]

図10は本発明による光信号処理装置の第6実施形態を示すブロック図である。光力ブラ10により抽出されたモニタ光としてのWDM信号光は任意の波長を有する光信号を通過させる光フィルタ60に供給される。基準パルス光を発生するために、発振器62により駆動されるパルス光源64が用いられている。光フィルタ60を通過した光信号及び基準パルス光は可飽和吸収デバイス(SA)74に供給される。可飽和吸収デバイス74の出力は光測定部68に供給される。光測定部68は可飽和吸収デバイス74から出力される光の平均パワーを検出する。この場合、コントローラ14は、光測定部68により検出された平均パワーが小さくなるように対応する遅延調整器8を制御する。

[0050]

図11の(A)及び(B)を参照すると、それぞれ可飽和吸収デバイス74の 入力及び出力の波形が示されている。パルス光源64から出力される基準パルス 光は、各光信号のクロック周波数のN(Nは自然数)分の1のクロック周波数を 有している。また、基準光パルスのパルス幅は、光信号のパルス幅とほぼ等しい 。図ではN=1として波形が示されている。

[0051]

図11の(A)に示されるように、光信号と基準パルス光のタイミングがずれている場合、図11の(B)に示されるように、可飽和吸収デバイス74における可飽和吸収効果の結果、光信号と基準パルス光が重なっている部分のパワーは各パワーの和よりも大きくなる。より特定的には、光信号と基準パルス光の変調位相が一致している場合に可飽和吸収デバイス74から出力される光の平均パワーが最大値となる。従って、図10に示される光測定部68で検出された平均パワーが最大になるようにコントローラ14が遅延調整器8を制御することによって、各光信号の位相を基準パルス光の変調位相に一致させることができる。

[0052]

光信号のクロック周波数のN分の1の発振周波数が発振器62及びパルス光源64において得られていない場合には、コントローラ14が発振器62の発振周波数を微調整することができる。即ち、利得飽和デバイス66の平均出力パワーの変動の時間周期が大きくなるように発振周波数を調整することによって、光信

号のクロック周波数のN分の1のクロック周波数を有する基準パルス光が得られる。

[0053]

図12は本発明による光信号処理装置の第7実施形態を示すブロック図である。ここでは、基準波長  $\lambda$  s の光信号を通過させる光フィルタ70と任意の波長  $\lambda$  i を有する光信号を通過させる光フィルタ72とを並列に設け、これらを通過した光信号が可飽和吸収デバイス74に入力するようにしている。光測定部68及びコントローラ14は図10に示される実施形態と同じように機能する。

[0054]

この構成によると、発振器62及びパルス光源64を用いることなしに、図10に示される実施形態における原理に準じて波長λiの光信号の変調位相を波長λsの光信号の位相に一致させることができる。尚、光フィルタ70及び72が無くても動作は可能である。

[0055]

図7に示される実施形態において、パルス光源64から出力される基準パルス 光の高さ(振幅)を変化させて利得飽和デバイス66の平均出力を測定すると、 光信号のパルス高さの分布が狭い場合には、利得飽和を起こすパルス高さが揃っ ているので、利得飽和デバイス66の出力と基準パルス光高さとの関係は、図1 3に示されるように、ある点で直線の傾きが変化する形で与えられる。一方、光 信号のパルス高さの分布が広い場合には、利得飽和を起こすパルス高さの分布が 広いため、利得飽和デバイス66の出力と基準パルス光高さとの関係は比較的な だらかな曲線で与えられる。従って、利得飽和デバイス66の出力と基準パルス 光高さとの関係に基き光信号のパルス高さの分布を検出することができる。

[0056]

図10に示される実施形態において、バルス光源64から出力される基準バルス光の高さ(振幅)を変化させて可飽和吸収デバイス74の平均出力を測定すると、光信号のパルス高さの分布が狭い場合には、可飽和吸収を起こすパルス高さが揃っているので、可飽和吸収デバイス74の出力と基準パルス光高さとの関係は、図14に示されるように、ある点で直線の傾きが変化する形で与えられる。

一方、光信号のパルス高さの分布が広い場合には、可飽和吸収を起こすパルス高さの分布が広いため、可飽和吸収デバイス74の出力と基準パルス光高さとの関係は比較的なだらかな曲線で与えられる。従って、可飽和吸収デバイス74の出力と基準パルス光高さとの関係に基き光信号のパルス高さの分布を検出することができる。

[0057]

図7の実施形態において、利得飽和デバイス66に入力する光信号のパルス幅が変化する場合を考える。図15は利得飽和デバイス66の出力と相対位相(基準パルス光と光信号の変調位相差)との関係を表している。光信号のパルス幅が狭い方がパルスパワーの中で利得飽和効果として働く割合が大きくなるので、相対位相の変化に対する利得飽和デバイス66の出力の変化が大きくなる。従って、利得飽和デバイス66の出力と相対位相との関係を得ることによって、光信号のパルス幅に関する情報を得ることができる。

[0058]

図10の実施形態において、可飽和吸収デバイス74に入力する光信号のバルス幅が変化する場合を考える。図16は可飽和吸収デバイス74の出力と相対位相(基準バルス光と光信号の変調位相差)との関係を表している。光信号のバルス幅が狭い方がバルスパワーの中で可飽和吸収効果として働く割合が大きくなるので、相対位相の変化に対する可飽和吸収デバイス74の出力の変化が大きくなる。従って、可飽和吸収デバイス74の出力と相対位相との関係を得ることによって、光信号のバルス幅に関する情報を得ることができる。

[0.059]

図17は本発明による光信号処理装置の他の基本構成を示すブロック図である。この基本構成は、図2に示される基本構成と対比して、各光信号のビットレートと同じビットレートのRZ信号に基き強度変調を行う光変調器76が光マルチープレクサ4の出力側に付加的に設けられている点で特徴付けられる。

[0060]

図17に示される装置の動作原理を図18により説明する。光変調器76(図 17参照)の入力においては、図2に示される基本構成の動作に従って、WDM 信号光の各光信号の位相差はできるだけ小さくされている。そのように処理されたWDM信号光が光変調器76によって強度変調される。変調信号としては、各光信号よりもデューティが僅かに小さいRZ信号の連続符号を用いることができる。光変調器76による変調によって、各光信号の位相の偏差に当たる部分の光パワーがほぼ0になり、WDM信号光における変調位相差をより小さくすることができる。光変調器76としてはマッハツェンダ光変調器その他の光変調器を用いることができる。

[0061]

また、利得飽和デバイス66(例えば図7参照)としては、半導体光増幅器や DFBレーザを用いることができる。更に、可飽和吸収デバイス74(例えば図 10参照)としては、例えば逆バイアスされた半導体光増幅器を用いることがで きる。

[0062]

図19は本発明の実施に使用可能な遅延調整器の実施形態を示す平面図である。ここでは、遅延調整器 8 は、異なる光路長を有する少なくとも2つの光導波路 7 8 と、少なくとも2つの光導波路 7 8 を切り換える少なくとも2つの光スイッチ80 とを備えている。図示された例では、6つの光導波路 7 8 を切り換えるために4つの光スイッチ80 が用いられている。並設された光導波路 7 8 間の遅延時間差を $\Delta$   $\tau$  1,  $\Delta$   $\tau$  2, …,  $\Delta$   $\tau$   $\tau$  n となるように設定することによって、遅延時間の調整幅を変更することができる。

[0063]

この構成によると、Si基板上に形成したガラス導波路等を用いることによって、遅延調整器をアレイ構成で複数集積化することが容易である。

[0064]

図20は本発明の実施に使用することができる遅延調整器の他の実施形態を示す斜視図である。ここでは、遅延調整器8は圧電効果を有する部材82と、部材82に巻回された光ファイバ84と、部材82に電圧を印加する可変電圧源86とを備えている。部材82としては例えば円筒形に形成された圧電物質を用いることができる。この実施形態によると、可変電圧源86によって部材82に印加

される電圧を変化させることによって、部材82の形状を変化させて光信号の遅 延時間を変化させることができる。

[0065]

尚、利得飽和デバイスの付加的詳細については、K. Inoue, "Suppression of signal fluctuation induced by crosstalk light in a gain saturated laser diode amplifier", IEEE Photon. Technol. Lett., vol.8, pp. 458, 1996を、また、可飽和吸収デバイスの付加的詳細については、I. Ogura, et al., "Pic osecond all-optical gate using a saturable absorber in mode-locked laser diodes", IEEE Photon. Technol. Lett., vol. 10, pp. 603, 1998を参照されたい。

[0066]

図21は本発明の実施に使用することができる遅延調整器の更に他の実施形態を示す平面図である。この実施形態は、図19に示される実施形態と対比して、 光スイッチ80及び80間に設けられる光導波路78の数を増やして得られる遅延時間の自由度を大きくしている点で特徴付けられる。

[0067]

遅延調整器において、光スイッチ80により異なる遅延量の光導波路78を切り替えるときに、遅延量の差が大きいと切り替え時に光信号のパルス幅が大きくなり波形劣化が大きくなる。また、遅延量の差が入力する光信号の波長の整数倍から大きく外れると、干渉による光信号の劣化が大きくなる。

[0068]

そこで、この実施形態では、遅延量が最も近い光導波路78間の遅延量の差が入力する光信号のビットレートの逆数の1/3以下で、且つ、遅延量の差が入力する光信号の波長の概ね整数倍となるようにして、上記問題に対処している。即ち、遅延量が異なる光導波路78を光スイッチ80により切り替えるときに、遅延量の差を光信号のビットレートの逆数の1/3以下にすることにより、光信号のバルス幅は4/3倍以下の幅に収まり、波形劣化を少なくすることができる。また、遅延量の差が光信号の波長の概ね整数倍となるようにしているので、切り替え時に2つの光導波路78を通る光が強め合う条件で動作させることができ、

干渉による光信号の劣化が少なくなる。

[0069]

図22は図1に示されるシステムに適用可能なパルス幅圧縮装置の構成図である。入力側の光ファイバ1と位相調整部3との間に一対のレンズ88及び88によりコリメート光学系を形成し、そのコリメート光学系に一対の反射型の回折格子90及び90を設けたものである。

[0070]

遅延調整器において、前述した実施形態のように複数の光スイッチ80と複数の光薄波路78とを組み合わせた場合に、光スイッチ80の切り替え時には不可避的に光信号のパルス幅が増大してある程度の波形劣化が生じる。そこで、図22に示されるように、位相調整部3に光信号が入力する前に光信号のパルス幅を圧縮しておくことによって、パルス幅増大による波形劣化が少なくなる。

[0071]

光ファイバ1が正常分散を有している場合、光ファイバ1内で自己位相変調に 伴う正のチャープ (光パルスの後端へ向かうにつれて周波数が増大する動的波長 変動)が生じる。この正のチャープが生じた光信号を回折格子90及び90で反 射させることによって、負の群速度分散(周波数の低い成分が遅くなる減少)を 与えることができ、光信号パルスの圧縮が可能である。

[0072]

図23は図1に示される全光再生部5の実施形態を示すブロック図である。全 光再生部5は、信号光を供給されて中間信号光を出力する第1の波形整形装置1 02と、中間信号光を第1及び第2の信号光に分割する光分岐器(例えば光カプラ)104と、第1の信号光を供給されてクロックパルスを出力する複数のクロック再生器72(#1, …, #4)と、第2の信号光及びクロックパルスを供給されてクロックパルスに同期した再生信号光を出力する第2の波形整形装置106とを備えている。

[0073]

波形整形装置102及び106の各々としては、非線形光学ループミラー (NOLM) を用いることができる。



#### [0074]

この基本構成によると、波形整形装置102及び106を用いていることにより、或いは、これに加えて図示しない光増幅器を用いていることにより、光レベルでの2R機能(リアンプリフィケーション及びリシェイピング)を得ることができる。また、クロック再生器72(#1, …, #4)で得られたクロックパルスを波形整形装置106に供給して、クロックパルスと第2の信号光とのANDを取るようにしているので、光レベルでのリタイミングを行うことができ、光レベルでの3R機能(2R機能及びリタイミング)を得ることができる。

# [0075]

WDM信号光は、偏波制御器122と、光遅延回路118としての光ファイバ120は 20とを介して第1の波形整形装置102に供給される。光ファイバ120は 波長分散  $\beta_2$ を有しており、WDM信号光の複数の光信号の各タイミングを時間 軸上で変化させる。偏波制御器122は、波形整形装置102及び106等が偏 波依存性を有している可能性に対処するために設けられており、WDM信号光の複数の光信号の各偏波状態を一定にするように機能する。偏波制御器122は、例えば、SOA(半導体光増幅器)におけるXPM(相互位相変調)或いはXGM(相互利得変調)を用いた光ゲートを各波長チャネルに適用することによって 構成され得る。

#### [0076]

偏波制御器122として上述のような光ゲートを用いている場合、偏波制御器122から出力される光の偏波面は、その光ゲートにおけるプローブ光の偏波面に確定されるので、波形整形装置102及び106等における偏波依存性に対処することができる。この場合、偏波制御器122から出力された光の偏波面を維持してその光を第1の波形整形装置102に供給するために、光ファイバ120として偏波面維持ファイバ(PMF)を用いることが望ましい。尚、光ファイバ120における偏波面維持能力が十分でない場合には、偏波制御器122は光ファイバ120と第1の波形整形装置102との間に設けられていても良い。

# [0077]

WDM信号光の光信号の波長はそれぞれ $\lambda_{S1}$ , …,  $\lambda_{S4}$ であり、互いに異なる

。これらの光信号はデータの繰り返し時間Tに比べて十分短い時間幅を有する光パルスによる強度変調により得られている。これらの光信号は、光ファイバ120により順にT/4の時間だけシフトさせられる。このようなWDM信号光が第1の波形整形装置102に供給されると、4チャネルの波長全てが単一の波長に変換されるので、第1の波形整形装置102から出力される中間信号光は光時分割多重信号(OTDM信号)となる。このようにして波長分割多重信号を時分割多重信号に変換することができる(WDM/OTDM変換)。

[0078]

ここでは、4チャネルの波長分割多重信号を例示しているが、チャネル数は4には限定されない。例えば、N(Nは1より大きい整数)チャネルの波長分割多重信号が用いられている場合には、Nチャネルの光時分割多重信号が得られる。この場合、N大の光遅延回路が用いられ、これらにおける時間シフトはT/Nに設定される。

[0079]

第1の波形整形装置102は、WDM/OTDM変換の機能を有しており、単一波長を有する光時分割多重信号を中間信号光として出力する。波形整形装置102としてNOLMが用いられている場合には、中間信号光の波長はNOLMのプローブ光の波長21に一致する。波形整形装置102から出力された中間信号光は、光分岐器104により第1及び第2の信号光に分割され、第1の信号光は各々クロック再生器72(#1,…,#4)に供給され、第2の信号光は第2の波形整形装置106に供給される。

[0080]

クロック再生器 72 (# 1, …, # 4) は、第 1 の信号光に基いてそれぞれ波 長 $\lambda_{C1}$ , …,  $\lambda_{C4}$ を有するクロックパルスを再生する。特にこの実施形態では、第 2 の波形整形装置 106 から出力される再生信号光における波長関係を入力されたWDM信号光における波長関係に一致させるために、波長 $\lambda_{C1}$ , …,  $\lambda_{C4}$ は波長 $\lambda_{S1}$ , …,  $\lambda_{S4}$ にそれぞれ等しく設定される。尚、各クロックパルスの周波数は、WDM信号光を構成している複数の光信号の各々の速度(繰り返し周波数;ビットレートに対応)に相当している。

[0081]

クロック再生器 72 (# 2, # 3 及び # 4) と第2の波形整形装置 106 との間には、それぞれ光遅延回路 124 (# 1, # 2 及び # 3) が付加的に設けられている。光遅延回路 124 (# 1, # 2 及び # 3) はそれぞれクロックパルスに遅延時間  $\tau_1$ ,  $\tau_2$ 及び  $\tau_3$ を与える。遅延時間  $\tau_1$ ,  $\tau_2$ 及び  $\tau_3$ は、それぞれ、中間信号光におけるあるパルスから次のパルス、その次のパルス、及びその次の次のパルスまでの時間間隔に設定される。

[0082]

この構成によると、第2の波形整形装置106において、時分割多重信号としての中間信号光(第2の信号光)が複数のクロックバルスを一括してスイッチングすることができるので、第1の波形整形装置102に入力されたWDM信号光に対する3R機能が可能になる。また、波形整形装置102及び106をWDM信号光の複数の波長チャネルに共用しているので、装置構成を簡単にしてシステムの信頼性を高めることができる。

[0083]

図24は図1に示される全光再生部5の他の実施形態を示すブロック図である。この実施形態は、図23の実施形態では各クロックパルスが中間信号光としての光時分割多重信号に基いて得られているのと対比して、波形成形されるべきWDM信号光に基いて各クロックパルスが得られている点で特徴付けられる。

[0084]

そのために、この実施形態では、図23に示される光分岐器104に代えて、第1の波形整形装置102の上流側、より特定的には偏波制御器122と光ファイバ120との間に光分岐器104′を設けている。光分岐器104′で分岐されたWDM信号光の一部は、WDM信号光の波長チャネル数に応じた複数の光フィルタ126(# $1, \cdots, #4$ )に供給される。光フィルタ126(# $1, \cdots, #4$ )はそれぞれ、WDM信号光の複数の光信号の波長 $\lambda_{S1}$ ,  $\cdots$ ,  $\lambda_{S4}$ に対応する通過帯域を有している。従って、光フィルタ126(# $1, \cdots, #4$ )によってそれぞれWDM信号光の複数の光信号を抽出することができる。

[0085]

クロック再生器72(#1, …, #4)の各々は、抽出された各光信号に基い で容易に各クロックバルスを再生することができる。

[0086]

この実施形態によると、図23に示される実施形態による場合と同様に、第2の波形整形装置106において、光時分割多重信号としての中間信号光(第2の信号光)が複数のクロックパルスを一括してスイッチングすることができるので、第1の波形整形装置102に入力されたWDM信号光に対する3R機能が可能になる。

[0087]

本発明は以下の付記を含むものである。

[0088]

(付記1) 入力ポート及び複数の出力ポートを有し上記入力ポートには異なる波長を有する複数の光信号を波長分割多重して得られたWDM信号光が供給される光デマルチブレクサと、

出力ポート及び複数の入力ポートを有する光マルチプレクサと、

上記複数の出力ポートと上記複数の入力ポートとをそれぞれ接続する複数の光 パスと、

上記複数の光パスの少なくとも一つに設けられた少なくとも一つの遅延調整器 と、

上記複数の光信号の少なくとも一つの変調位相を検出する検出器と、

上記検出器により検出された位相に基き上記遅延調整器を制御するコントローラとを備えた光信号処理装置。

[0089]

(付記2) 上記光マルチプレクサの出力ポートに接続され上記各信号のビットレートと同じビットレートのRZ信号に基き強度変調を行う光変調器を更に備えた付記1記載の光信号処理装置。

[0090]

(付記3) 上記検出器は、

基準となる波長を有する光信号を通過させる光フィルタと、

### 特2000-264186

上記光フィルタを通過した光信号に基き基準クロックを再生する回路と、

任意の波長を有する光信号を通過させるチューナブル光フィルタと、

上記チューナブル光フィルタを通過した光信号に基きクロックを再生する回路 と、

上記基準クロック及び上記クロックの位相比較を行う位相比較器とを含む付記 1 記載の光信号処理装置。

[0091]

(付記4) 上記検出器は、

任意の波長を有する光信号を通過させるチューナブル光フィルタと、

上記チューナブル光フィルタを通過した第1の波長を有する第1の光信号及び 第2の波長を有する第2の光信号に基づきそれぞれ第1及び第2のクロックを再 生する回路と、

上記第1及び第2のクロックの位相比較を行う位相比較器とを含む付記1記載 の光信号処理装置。

[0092]

(付記5) 上記検出器は、

基準となる波長を有する光信号を通過させる光フィルタと、

上記光フィルタを通過した光信号に基き基準クロックを発生する回路と、

任意の波長を有する光信号を通過させるチューナブル光フィルタと、

上記チューナブル光フィルタを通過した光信号に基きクロックを再生する回路 と、

上記基準クロック及び上記クロックの位相比較を行う位相比較器とを含む付記 1 記載の光信号処理装置。

[0093]

(付記6) 上記検出器は、

基準パルス光を発生するパルス光源と、

任意の波長を有する光信号を通過させる光フィルタと、

上記光フィルタを通過した光信号及び上記基準パルス光が供給される利得飽和 デバイスとを含み、 上記コントローラは上記利得飽和デバイスから出力される光の平均パワーが小 さくなるように上記遅延調整器を制御する回路を含む付記1記載の光信号処理装 置。

[0094]

(付記7) 上記基準パルス光は上記各光信号のクロック周波数のN(Nは自然数)分の1のクロック周波数を有する付記6記載の光信号処理装置。

[0095]

(付記8) 上記利得飽和デバイスから出力される光の平均パワーに基いて上 記各光信号のパルス高さの分布を検出する手段を更に備えた付記6記載の光信号 処理装置。

[0096]

(付記9) 上記検出器は、

第1の波長を有する光信号を通過させる第1の光フィルタと、

第2の波長を有する光信号を通過させる第2の光フィルタと、

上記第1及び第2の光フィルタをそれぞれ通過した光信号が供給される利得飽 和デバイスとを含み、

上記コントローラは上記利得飽和デバイスから出力される光の平均パワーが小さくなるように上記遅延調整器を制御する回路を含む付記1記載の光信号処理装置。

[0097]

(付記10) 上記検出器は、

基準パルス光を発生するパルス光源と、

任意の波長を有する光信号を通過させる光フィルタと、

上記光フィルタを通過した光信号及び上記基準バルス光が供給される可飽和吸収デバイスとを含み、

上記コントローラは上記可飽和吸収デバイスから出力される光の平均パワーが 大きくなるように上記遅延調整器を制御する回路を含む付記1記載の光信号処理 装置。

[0098]

(付記11) 上記基準パルス光は上記各光信号のクロック周波数のN(Nは 自然数)分の1のクロック周波数を有する付記10記載の光信号処理装置。

[0099]

(付記12) 上記可飽和吸収デバイスから出力される光の平均パワーに基いて上記各光信号のパルス高さの分布を検出する手段を更に備えた付記10記載の 光信号処理装置。

[0100]

(付記13) 上記検出器は、

第1の波長を有する光信号を通過させる第1の光フィルタと、

第2の波長を有する光信号を通過させる第2の光フィルタと、

上記第1及び第2の光フィルタをそれぞれ通過した光信号が供給される可飽和 吸収デバイスとを含み、

上記コントローラは上記可飽和吸収デバイスから出力される光の平均パワーが 大きくなるように上記遅延調整器を制御する回路を含む付記1記載の光信号処理 装置。

[0101]

(付記14) 上記遅延調整器は、異なる光路長を有する少なくとも2つの光 導波路と、上記少なくとも2つの光導波路を切り換える少なくとも2つの光スイ ッチとを含む付記1記載の光信号処理装置。

[0102]

(付記15) 上記遅延調整器は、圧電効果を有する部材と、上記部材に巻回された光ファイバと、上記部材に電圧を印加する可変電圧源とを含む付記1記載の光信号処理装置。

[0103]

(付記16) 位相調整部と全光再生部とを備えた光信号処理装置であって、

上記位相調整部は、入力ポート及び複数の出力ポートを有し上記入力ポートに は異なる波長を有する複数の光信号を波長分割多重して得られたWDM信号光が 供給される光デマルチプレクサと、

出力ポート及び複数の入力ポートを有する光マルチプレクサと、

上記複数の出力ポートと上記複数の入力ポートとをそれぞれ接続する複数の光 パスと

上記複数の光パスの少なくとも一つに設けられた少なくとも一つの遅延調整器 と、

上記複数の光信号の少なくとも一つの変調位相を検出する検出器と、

上記検出器により検出された変調位相に基き上記遅延調整器を制御するコント ローラとを備えている光信号処理装置。

[0104]

【発明の効果】

以上説明したように、本発明によると、WDM信号光の複数の光信号の変調位 相に安定した時間秩序を与えることができる光信号処理装置の提供が可能になる という効果が生じる。また、この光信号処理装置と全光再生器とを組み合わせる ことによって、安定した動作が可能な全光再生中継器の提供が可能になるという 効果が生じる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

図1は本発明によるシステムの実施形態を示すブロック図である。

【図2】

図2は本発明による光信号処理装置の基本構成を示すブロック図である。

【図3】

図3は本発明による光信号処理装置の第1実施形態を示す主要部のブロック図である。

【図4】

図4は位相同期ループの構成を示すブロック図である。

【図5】

図5は本発明による光信号処理装置の第2実施形態を示す主要部のブロック図である。

【図6】

図6は本発明による光信号処理装置の第3実施形態を示す主要部のブロック図

である。

[図7]

図7は本発明による光信号処理装置の第4実施形態を示すブロック図である。

【図8】

図8の(A)及び(B)はそれぞれ図7に示される利得飽和デバイス66の入 力及び出力の波形を示す図である。

【図9】

図9は本発明による光信号処理装置の第5実施形態を示すブロック図である。

【図10】

図10は本発明による光信号処理装置の第6実施形態を示すブロック図である

【図11】

図11の(A)及び(B)はそれぞれ図10に示される可飽和吸収デバイス74の入力及び出力の波形を示す図である。

【図12】

図12は本発明による光信号処理装置の第7実施形態を示すブロック図である

【図13】

図13は図7に示される利得飽和デバイス66の出力と基準パルス光の高さとの関係を示すグラフである。

【図14】

図14は図10に示される可飽和吸収デバイス74の出力と基準パルス光の高 さとの関係を示すグラフである。

【図15】

図15は図7に示される利得飽和デバイス66の出力と相対位相の関係を示すグラフである。

【図16】

図16は図10に示される可飽和吸収デバイス74の出力と相対位相の関係を 示すグラフである。 【図17】

図17は本発明による光信号処理装置の他の基本構成を示すブロック図である

【図18】

図18は図17に示される装置の動作原理を説明するための図である。

【図19】

図19は本発明の実施に使用することができる遅延調整器の実施形態を示す平 面図である。

【図20】

図20は本発明の実施に使用することができる遅延調整器の他の実施形態を示す斜視図である。

【図21】

図21は本発明の実施に使用することができる遅延調整器の更に他の実施形態 を示す平面図である。

【図22】

図22は図1に示されるシステムに適用可能なパルス幅圧縮装置の構成図である。

[図23]

図23は図1に示される全光再生部の実施形態を示すブロック図である。

【図24】

図24は図1に示される全光再生部の他の実施形態を示すブロック図である。

【符号の説明】

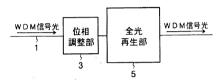
- 1 光ファイバ伝送路
- 2 光デマルチプレクサ
- 3 変調位相調整部
- 4 光マルチプレクサ
- 5 全光再生部
- 8 遅延調整器
- 12 検出器

- 14 コントローラ
- 16 カプラ

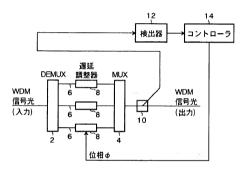
【書類名】

図面

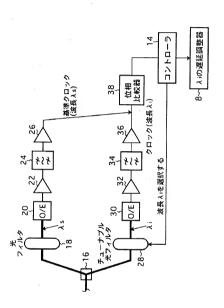
【図1】



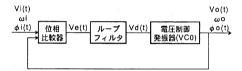
【図2】



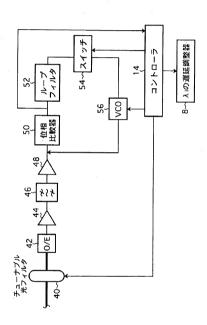
【図3】



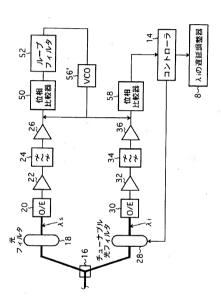
【図4】



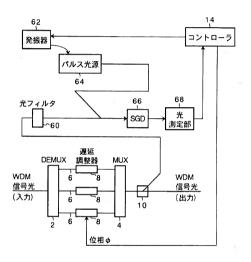
【図5】



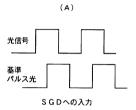
【図6】

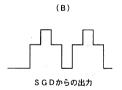


【図7】

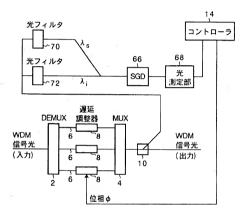


【図8】

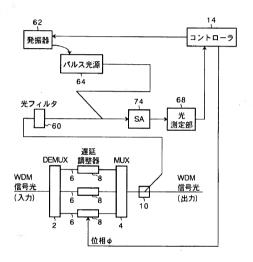




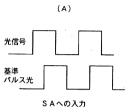
【図9】

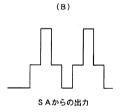


【図10】

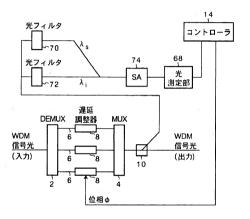


【図11】

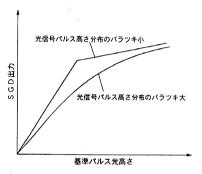




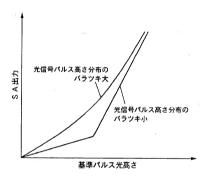
【図12】



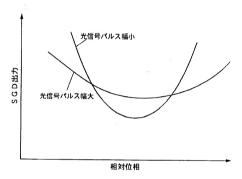
【図13】



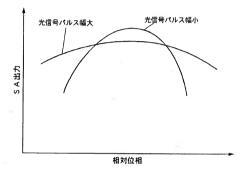
【図14】



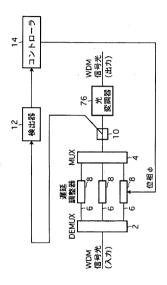
【図15】



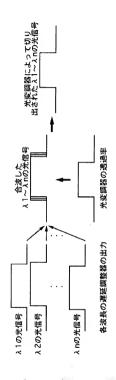
【図16】



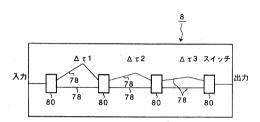
【図17】



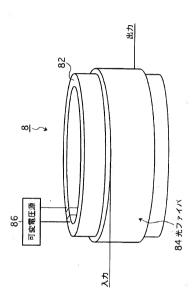
【図18】



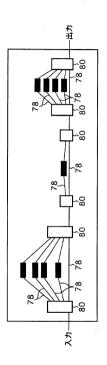
【図19】



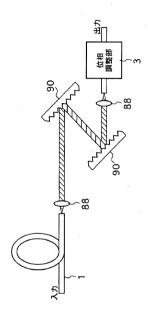
【図20】



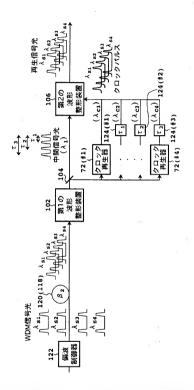
【図21】



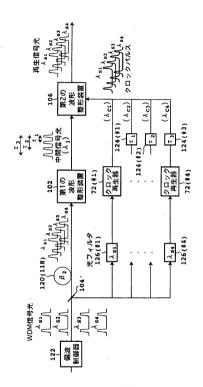
【図22】



【図23】



## 【図24】



【書類名】

要約書

【要約】

[課題] 本発明は、WDM信号光の複数の光信号の変調位相に安定した時間秩 序を与えることができる光信号処理装置の提供を課題としている。

【解決手段】 本発明による光信号処理装置は、WDM(波長分割多重)に適合するために、光デマルチプレクサ2及び光マルチプレクサ4を備えている。光デマルチプレクサは入力ポート及び複数の出力ポートを有し、入力ポート2は異なる波長を有する複数の光信号を波長分割多重して得られたWDM信号光が供給される。光マルチプレクサは出力ポート及び複数の入力ポートを有している。光デマルチプレクサの複数の出力ポートと光マルチプレクサの複数の入力ポートはそれぞれ複数の光パス6により接続される。光パスには遅延調整器8が設けられる。複数の光信号の少なくとも一つの位相が検出器12により検出され、検出された変調位相に基づきコントローラ14が遅延調整器8を制御する。これにより、各光信号の位相を容易に一致させることができる。

【選択図】 図2

## 出願人履歷情報

識別番号

1

[000005223]

1. 変更年月日

1996年 3月26日

[変更理由] 住 所

住所変更

神奈川県川崎市中原区上小田中4丁目1番1号

氏 名 富士通株式会社